

DIFFRACTOMÈTRE X

FICHE N° 2142

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Philips Electronics N.V.

Domaines : Physique

Sous-domaines :

Organisme : Université du Maine

Ville : Le Mans

Modèle : X'PERT PUV3084

Matériaux :

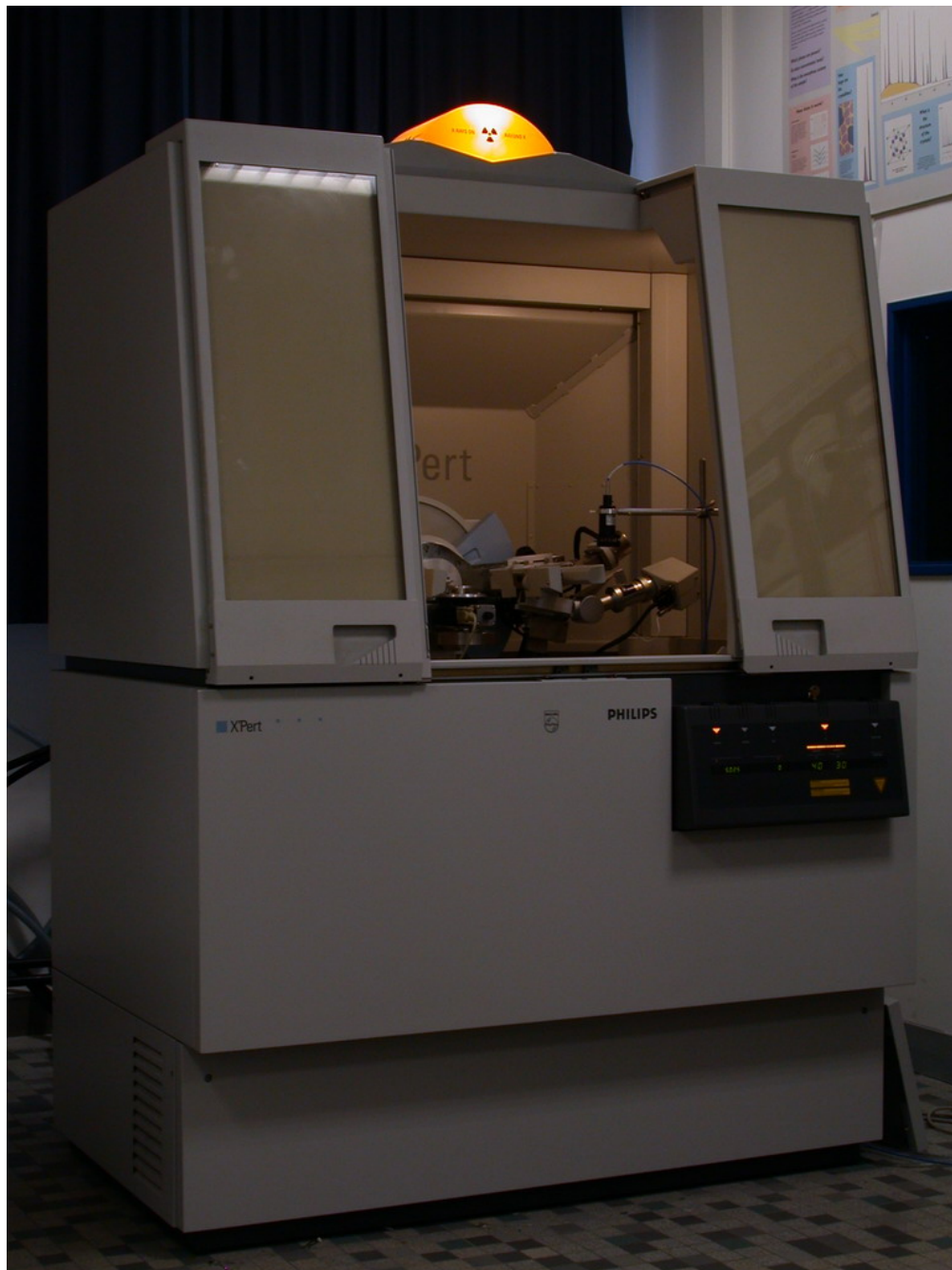
Description

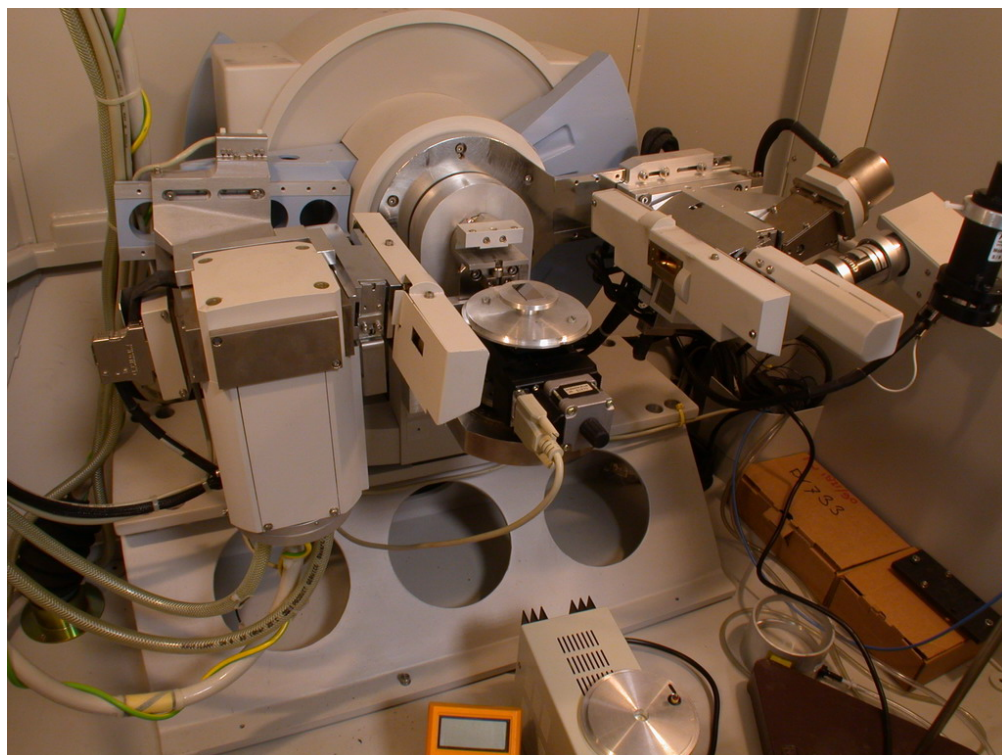
Le diffractomètre X'pert PUV3084 de PHILIPS comprend une plateforme où est positionné l'échantillon à étudier. Cette plateforme peut être orientée en fonction de la face du cristal à observer. Deux bras entourent cette plateforme, ils contiennent respectivement la source de rayonnement et le détecteur. L'appareil envoie sur le cristal un faisceau de rayons X monochromatique. Les rayons X interagissent entre eux et avec les atomes du cristal. Cela induit une émission de rayons de même fréquence, c'est la diffraction X. Le détecteur tourne autour de l'échantillon et enregistre l'intensité des rayons X refractés à différentes positions.

Utilisation

Cet appareil était utilisé pour l'étude de couches minces sur silicium au Laboratoire de physique de l'état condensé à l'Université du Maine.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Diffractomètre X (Philips Electronics N.V.), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=2578>, consulté le 2026-07-22